

2026年度 非破壊検査総合シンポジウムプログラム (予定)

2026年 6月4日(木)~5日(金)

(一社)日本非破壊検査協会 亀戸センター

(東京都江東区亀戸 2-25-14 京阪亀戸ビル6階)

参加登録料: (消費税込)

種別	5月28日迄
会 員	5,000円
一 般 ^{§1}	12,000円
学生会員	2,000円
学生一般 ^{§1}	5,000円
懇親会費	5,000円

※ 参加申込締切は5月28日(木)迄となります。

※ 今回のシンポジウムを機会に、当協会会員に新規入会されることをお勧めいたします。詳しくは、事務局までお問合せください。

§1 一般の方: 上記締切後は参加登録料が変わります。

一般: 16,000円、学生一般: 8,000円

講演概要集: PDF形式でダウンロード配付(パスワードはシンポジウム初日に参加登録者へメール配信)。CDにデータを保存して配送(予定)いたします。

参加申込: 参加申込をされる方は、協会ホームページ(<https://www.jsndi.jp/>)の「学術活動」→「総合シンポジウム」→「参加申込」よりお申し込みください。

問合先: (一社)日本非破壊検査協会 学術部学術課
TEL: 03-5609-4015 E-mail: taikai@jsndi.or.jp

6月4日(木)

第1会場

9:10~9:20 開会の挨拶

学術委員長 望月正人

《cos α 法方式によるX線残留応力測定技術研究会/UT部門》

9:30~10:15 OS: 二次元検出器及びcos α 法によるX線応力測定法 I

座長 黒瀬雅詞(群馬工業高等専門学校)

9:30~9:45 多方向 X 線測定による応力状態の可視化—MSCR 法によるモールド力円の逆構成—
(株)X線残留応力測定センター ○三島由久

9:45~10:00 X線応力測定における測定器と鉄筋のなす角度に関する実験的検討
東京電力ホールディングス(株) ○岡 滋晃
東京電力パワーグリッド(株) 藤原昌紀, 山本祐美加

10:00~10:15 ばね鋼における X 線 cosa 法の三軸応力測定に関する基礎的研究
三菱製鋼(株) ○山崎智裕
金沢大学 佐々木敏彦

10:25~11:10 OS: 二次元検出器及びcos α 法によるX線応力測定法 II

座長 嘉村直哉(NIN(株))

10:25~10:40 cos α 法を用いた任意方向応力の推定
(株)不二越 ○乾 典規
滋賀大学 三井真吾
金沢大学 佐々木敏彦

10:40~10:55 機械学習を用いた三軸応力による転がり疲労の定量評価(2)
滋賀大学 ○三井真吾
(株)不二越 乾 典規
金沢大学 佐々木敏彦

10:55~11:10 カドミレス快削黄銅の旋削加工における加工履歴の影響
群馬工業高等専門学校 ○黒瀬雅詞
(株)山岸製作所 高井 豊, 山岸祐二
群馬産業技術センター 矢澤 歩, 岩沢知幸, 小谷雄二

11:20~11:50 OS: 二次元検出器及びcos α 法によるX線応力測定法 III

座長 三島由久((株)X線残留応力測定センター)

11:20~11:35 cosa 法を用いた不完全デバイ環の応力評価に関するシミュレーション研究
岩手医科大学 ○江尻正一
神奈川工科大学 大場宏明
金沢大学 佐々木敏彦

11:35~11:50 cosa 法の基礎的仮定に関する検討(2)
金沢大学 ○佐々木敏彦, 浜崎友貴
菊地遵一, 杉本修一, 上乗亮子

13:30~14:55 超音波探傷試験 ~探傷装置および鉄鋼分野における歴史~ I

座長 森 大輔(大同特殊鋼(株))

13:30~13:35 開会挨拶
愛媛大学 中畑和之

13:35~14:05 超音波探傷器と超音波探触子の変遷
ベーカーヒューズ・エナジージャパン(株) ○中川真一
(株)検査技術研究所 刈谷晃洋

14:05~14:30 フェーズドアレイ超音波探傷装置の技術進化と国際規格の概説
Eddyfi Technologies Inc. ○松園真一, Guy MAES

14:30~14:55 製鉄所における自動超音波探傷の技術進化
JFE スチール(株) ○飯塚幸理

15:10~16:25 超音波探傷試験 ~探傷装置および鉄鋼分野における歴史~ II

座長 星 延幸((株)日本製鋼所)

15:10~15:35 特殊鋼における超音波探傷技術の歴史
大同特殊鋼(株) ○森永 武, 森 大輔

15:35~16:00 素形材(鍛鋼品)における超音波探傷試験の歴史
(株)日本製鋼所 ○蝦名 崇

16:00~16:25 製鉄所における超音波非破壊評価
日本製鉄(株) ○宮本 充

《特別講演》

16:45~17:45 特別講演

座長 日本非破壊検査協会会長 落合 誠((株)東芝)

「最近の海事関連の話題と非破壊検査に期待すること」

(一財)日本海事協会 ○山口欣弥

第2会場

《MT/PT/VT・ET/MFLT・LT部門合同》

9:30~11:40 表面NDTワークショップ(1)

—若手研究発表—

座長 笠井尚哉(横浜国立大学)

9:30~9:40 開会挨拶

横浜国立大学 笠井尚哉
大分大学 後藤雄治

9:40~10:00 小口径鋼管を対象とした渦電流探傷プローブの小型化の検討
大分大学 ○小松原魁, 高 炎輝, 後藤雄治

10:00~10:20 電磁力振動を用いたPCグラウト充填評価の検討
群馬大学 ○丹羽章太郎, 三輪空司
大分大学 後藤雄治

- 10:20~10:40 反発配置の矩形永久磁石を用いた搬送鋼棒の周方向欠陥位置推定の提案
大分大学 ○松島弘汰, 後藤雄治
東京大学 志久寛太, 奈良高明
- 10:40~11:00 矩形波渦電流探傷試験における深層学習回帰モデルを用いたきず高さの評価
九州大学 ○郭 子維, 笹山瑛由
- 11:00~11:20 ハルバツハ配列を用いた電磁力加振による地熱発電所の鋼管内部の温泉スケール厚み測定
大分大学 ○永原優志, 山田圭吾, 後藤雄治
九州大学 笹山瑛由
福岡県工業技術センター 田口智之
- 11:20~11:40 鋼板の内部欠陥検出に向けた磁気非破壊検査法における磁気応答の鋼板厚さ依存性
同志社大学 ○田中康介, 佐藤祐喜, 堺 健司

11:50~12:50 表面NDTワークショップ(2)
—Keynote Lecture—

座長 渡邊郁雄 ((株)東芝)

- 11:50~12:50 分布型水素漏えい検知センサの開発
—光ファイバ型水素センサの研究事例を中心として—
横浜国立大学 ○岡崎慎司

14:00~14:15 表面NDTワークショップ(3)
—委員会報告—

座長 渡邊郁雄 ((株)東芝)

- 14:00~14:15 電磁非破壊検査を支援する逆問題解析に関する調査研究委員会の活動報告
東北大学 ○吉岡幸次郎

14:20~16:00 表面NDTワークショップ(4)
—検査技術の産業応用—

座長 後藤雄治 (大分大学)

- 14:20~14:40 磁粉探傷試験における紫外線の安全性と観察条件・励磁電流波高率が検出感度に及ぼす影響—MT規格における懸案事項の検討—
日本電磁測器(株) ○堀 充孝
(地独)東京都立産業技術研究センター 西村信司
マークテック(株) 一本哲男
- 14:40~15:00 三極磁化器とコイルレイセンサーを組み合わせた溶接部欠陥自動検出システムの開発
横浜国立大学 ○福田帆乃香
Le Quang Trung, 笠井尚哉
- 15:00~15:20 渦電流探傷による金属積層造形インプロセスモニタリングに対する影響因子の評価
(株)東芝 ○小林徳康, 荒木翔太, 廣田圭一
椎原克典, 片山義紀, 中島弘達
千田 格, 高橋菜太, 山本 撰
- 15:20~15:40 マイクロマグネティクス法を用いた熱処理製品の硬度測定と不確かさ評価
(株)構造計画研究所 ○上谷佳祐
セフ シャハブディン, 廣瀬健康
- 15:40~16:00 表彰式・閉会挨拶
大分大学 後藤雄治
(株)東芝 渡邊郁雄

第3会場

《RT部門》

13:30~14:57 放射線によるイメージングとその活用 I

座長 富澤雅美 (東芝ユニファイドテクノロジーズ(株))

- 13:30~13:33 閉会挨拶
東芝ユニファイドテクノロジーズ(株) 富澤雅美

- 13:35~14:15 種々の中性子イメージング手法とそれで見えるもの
北海道大学 ○鬼柳善明
- 14:17~14:57 超精密加工における計測 CT の活用方法—ロボナノ加工品の三次元計測を例に—
慶應義塾大学 ○藤本弘之, 高野朋幸

15:10~16:30 放射線によるイメージングとその活用 II

座長 岸 武人 ((株)島津製作所)

- 15:10~15:35 中性子を用いた接着系あと施工アンカーの安全性能向上に資する研究
日本原子力研究開発機構 ○原山 勲
- 15:35~16:00 中性子と X 線の相補的利用による内部構造解析—文化財・古生物研究への応用—
京都大学 ○伊藤大介
- 16:00~16:25 Dual Energy CT 技術によるマイクロフォーカス X 線 CT 画質改善
(株)島津製作所 ○岡村宙輝, 大西修平
- 16:25~16:30 閉会挨拶
東芝ユニファイドテクノロジーズ(株) 富澤雅美

18:15~20:15 懇親会 (会場: アンフェリシオン)

江東区亀戸 1-43-22 TEL:03(5836)5111
URL: <https://anfelicion.jp/>

6月5日 (金)

第1会場

《TT部門》

9:30~10:50 OS: 赤外線を中心とする電磁波を用いた試験とその周辺技術 I

座長 和泉遊以 (滋賀県立大学)

- 9:30~9:50 FSW 接合部の非破壊検査におけるレーザ加熱アクティブ赤外線サーモグラフィ法の適用
広島大学 ○西古鈴々花, 小川裕樹, 杉本幸弘
曙 紘之, 菅田 淳
- 9:50~10:10 各種の材料中を伝搬する熱波動群速度の実験的観測
徳島大学 ○西田好佑, 石川真志, 西野秀郎
- 10:10~10:30 超音波励起サーモグラフィ法による CFRP 中の層間はく離検査—伝搬超音波振動と可検出はく離条件との関係—
徳島大学 ○石川真志, 西野秀郎
明星大学 小山昌志
(株)KJTD 福井 涼
- 10:30~10:50 2026 SPIE Defense and Security Exhibition の概要報告
(株)ケン・オートメーション ○矢尾板達也

11:00~12:00 OS: 赤外線を中心とする電磁波を用いた試験とその周辺技術 II

座長 石川真志 (徳島大学)

- 11:00~11:20 深層学習を援用した Sonic-IR 法によるスポット溶接のナゲット形成不良検知
滋賀県立大学 ○和泉遊以, 田邊裕貴
小島颯太, 片岡陽太
三菱自動車 江口勇氣, 曲田吉史
- 11:20~11:40 レーザサーモグラフィ法による塗膜下の疲労き裂検出
神戸大学 ○中西佑斗, 村尾侑哉
塩澤大輝, 阪上隆英
大同特殊鋼(株) 山下正和, 森 大輔
- 11:40~12:00 正規化昼夜差分処理による剥離の自動検出
防衛大学校 ○小笠原永久, 宮本愛翔, 渡邊聖也
黒田一郎, 山田浩之

第2会場

《SSM 部門》

9:30~10:50 応力・ひずみ測定と強度評価 I

座長 小野勇一 (鳥取大学)

- | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 9:30~ 9:50 | インプリント成形における透明樹脂表面への転写精度の評価 | |
| 9:50~10:10 | 高精度ひずみ分布計測による水素蓄圧容器の損傷評価法の検討 | 近畿大学 ○伊藤寛明, 橋口奈央 |
| 10:10~10:30 | 衝撃微小押込み試験による PC および PMMA 表面の評価 | 明治大学 ○松原晴香, 有川秀一
松尾卓摩, 梶原 翔 |
| 10:30~10:50 | 逆ひずみ速度依存性を有する可変剛性メタマテリアル | 豊橋技術科学大学 ○足立忠晴
明治大学 ○赤沢和輝, 有川秀一 |

11:00~12:20 応力・ひずみ測定と強度評価 II

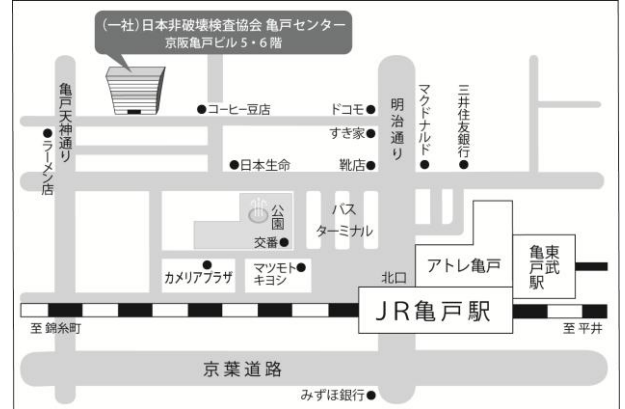
座長 足立忠晴 (豊橋技術科学大学)

- | | | |
|-------------|---|--|
| 11:00~11:20 | 負荷条件および温度依存性を考慮した形状記憶ポリマーの回復挙動予測 | 明治大学 ○清水瑛介, 森田一輝
澁谷早希, 有川秀一 |
| 11:20~11:40 | 音波駆動拡張ユニット構造の高性能化に向けた理論的検討 | 明治大学 ○三條大斗, 平野華英, 有川秀一 |
| 11:40~12:00 | スペックル干渉法のための CNN を用いた位相解析法の検討 | 明治大学 ○麻妻あかり, 湯原 諒, 有川秀一 |
| 12:00~12:20 | 電着銅薄膜を用いた繰返し応力測定法 (デバイ環の X 線入射方向依存性を利用した主応力測定法) | Warsaw University of Technology Maria Cywińska
鳥取大学 ○小野勇一, 足立健流
大西由基, 中村幸暉 |

14:00~15:00 社員総会

【会場案内図】 一般社団法人 日本非破壊検査協会 亀戸センター

JR 総武線・東武亀戸線「亀戸駅」下車、北口より徒歩 約 5 分



注) 座長及びプログラムは、変更される場合があります。

- 講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は、事前に登壇者の了承を得た上で、登壇前に座長へ申し出るようお願いいたします。
- シンポジウム運営側にて録画を行う場合がありますが、録画はシンポジウムの運営上の利用に限定され、公募等は一切行いません。
- 座長の状況判断により発表順番の入れ替え等を行う可能性がある事をご了解ください。
- 最新情報につきましては、ホームページにて順次公開させていただきます。誠にお手数をお掛けいたしますが、ホームページをご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 本シンポジウムは JIS Z 2305 非破壊試験技術者のレベル 3 再認証試験に適用できるクレジット・システムに該当しております。会場に配置している出席証明書に、座長のサインをお求めください。※事後の発行は対応しておりません。